

JEDEC / JEITA / IPC規格基準

INSIDIX
NON-DESTRUCTIVE TESTING

プロジェクション・モアレ式
高精度 反り・変形測定システム

TDM[®] >>> TABLE TOP

高精度

- ◆ 反り (Z) 分解能
1.5 μm
- ◆ 空間分解能 (X,Y)
37.5 μm
- ◆ 被写界深度
~ 20mm

高機能

- ◆ CTE 計測 (オプション)
反りと同時計測可能
- ◆ 強力ヒーター搭載
上下のヒーターを
独立して制御可能

コンパクト

- ◆ 卓上型
- ◆ 測定可能エリア
75mm \times 75mm
- ◆ 圧縮空気・排気不要



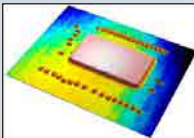
幅広いアプリケーションに対応

- ◆ 部品特性評価：
BGA (はんだボール有り/なし) IC、CSP、PoP 等
- ◆ リフロープロファイルとの互換性のための部品認定
- ◆ 部品硬化プロセスの最適化
- ◆ JEITA-ED-7306 IPC-9641 / JEDEC 22B112A に
準じた部品及び PCB の認定

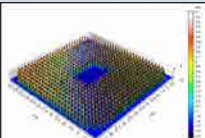
特長・優位点

- ◆ 特殊なユーティリティが不要 (電源のみ必要)
- ◆ 超高スループット
- ◆ 上下独立してコントロール可能なヒーターを使用し、
優れた温度均一性を実現
- ◆ 高速加熱冷却ヒーター
- ◆ 微細解析のための超高解像度カメラ
- ◆ サンプルの出し入れが簡単なサンプルホルダー

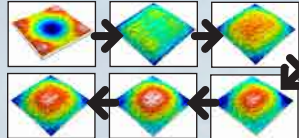
計測例
Application



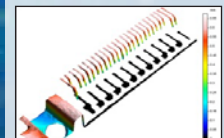
ベア・ダイ



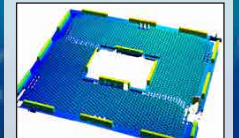
BGAのバンブ側



BGAリフロー



コネクター



複合基板